

XRF元素录井仪

SHENKAI

采用X射线荧光分析技术,以随钻获取的岩屑粉末为分析对象,从中获得元素组成(组分、含量及分布规律)信息,通过元素组合特征而识别岩性、判断划分地层,进一步开展深层次的数据分析处理,寻找与储集层物性、含油气性规律,实现评价储集层的目的。

仪器特点

- 能够实时提供多条元素曲线,为现场进行地层对比和划分提供量化的数据和曲线。
- 元素的含量数据能够如实地反映了岩石的物质基础,有助于从本质上认识岩石和地层。

井况复杂,无法进行测井,需要量化的曲线进行剖面恢复和地层划分。特酸岩性的识别,如碳酸盐岩、火成岩的解释。



技术指标

元素分析范围	钠(Na)—铀(U)
含量分析范围	1PPM-99.99%(不同元素含量范围不同)
测量时间	30-200秒
探测器	电制冷Fast-SDD半导体探测器
仪器分辨率	(127±5)eV
多道分析器	2048道
输入电压	AC 220V±10% 50HZ环境湿度:30%-80%
脉冲成型	三角脉冲成型,脉冲成型时间≤2μS, 脉冲模式与谱线模式自由互换
高清CCD	500万像素
真空泵额定功率	550W
圆形样品真空腔	240×83mm
微分非线性<0.1%,积分非线性<0.01%	
程控增益控制,1-65535级微细可调	
10秒真空度可达10-2pa(高真空区域10-5pa)	